DERWENT-ACC-NO: 1998-276215

DERWENT-WEEK: 199825

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Active matrix reflecting LCD device - has pixel

electrode with nickel

plating layer formed on surface of transparent electrically

conductive film

PATENT-ASSIGNEE: SEIKO EPSON CORP[SHIH]

PRIORITY-DATA: 1996JP-0245345 (September 17, 1996)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 10090711 A April 10, 1998 N/A

008 G02F 001/1343

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 10090711A N/A 1996JP-0245345

September 17, 1996

INT-CL (IPC): G02F001/1343; G02F001/136; H01L029/786

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 10090711A

BASIC-ABSTRACT: The device has several data lines and

scanning lines formed in

the shape of a matrix on any one of the substrates between which an LC is

enclosed. A source area is electrically connected to the data line and a gate

electrode is electrically connected to the scanning line. A TFT is equipped

with a pixel electrode (40) electrically connected to a drain area.

The pixel electrode has a nickel plating layer (45V) formed on the surface of a

transparent electrically conductive film (41). Electric

power is supplied to

the transparent electrically conductive film via a terminal

02/24/2003, EAST Version: 1.03.0002

group, data driver, data line and TFT.

ADVANTAGE - Detects pixel defect reliably. Improves production efficiency.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.3/9

TITLE-TERMS:

ACTIVE MATRIX REFLECT LCD DEVICE PIXEL ELECTRODE NICKEL PLATE LAYER FORMING

SURFACE TRANSPARENT ELECTRIC CONDUCTING FILM

DERWENT-CLASS: P81 U14

EPI-CODES: U14-H01A; U14-K01A1B; U14-K01A2B;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1998-217124

02/24/2003, EAST Version: 1.03.0002

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-90711

(43)公開日 平成10年(1998) 4月10日

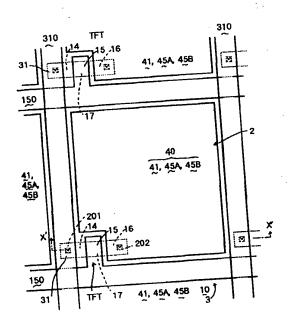
(51) Int.Cl.* G 0 2 F 1/1343 1/136	體別記号 500	FI G02F 1/1343 1/136 500 H01L 29/78 612C
H01L 29/786		審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)
(21)出顧番号	特顧平8-245345	(71)出題人 000002369 セイコーエブソン株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号
(22)出顧日	平成8年(1996) 9月17日	(72)発明者 鹿川 祐一 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ
		ーエブソン株式会社内 (74)代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)

(54) [発明の名称] 反射型液晶表示装置およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】画素欠陥を検出することのできる反射型液晶表 示装置およびその製造方法を提供すること。

【解決手段】 アクティブマトリクス基板3では、画素 電極40を形成する際に透明導電膜41表面にニッケル めっき層45Bを形成してあるので、反射型液晶表示装 置用として用いることができる。透明導電膜41を形成 した後、ニッケルめっき層45Bを形成しなければ、透 過型液晶表示装置用として用いることができる。ニッケ ルめっき層45Bを形成する際には、端子群、走査ドラ イバ部および走査線150を介してTFTをオン状態と し、端子群、データドライバ部、データ線310および TFTを介して透明導電膜41に給電して電解めっきを 行うので、ニッケルめっき層45Bの有無から画素電極 40のオーアンを検出できる。



()

. }

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の基板間に封入された液晶と、前記 一対の基板のうちの一方の基板上にマトリクス状に形成 されたデータ線および走査線と、前記一方の基板上で前 記データ線に電気的接続するソース領域、前記走査線に 電気的接続するゲート電極、および画素電極に電気的接 続するドレイン領域を備える薄膜トランジスタとを有す る反射型液晶表示装置において、

前記画素電極は、透明導電膜と、該透明導電膜の表面に 形成された無電解めっき層とを備えていることを特徴と 10 する反射型液晶表示装置。

【請求項2】 一対の基板間に封入された液晶と、前記 一対の基板のうちの一方の基板上にマトリクス状に形成 されたデータ線および走査線と、前記一方の基板上で前 記データ線に電気的接続するソース領域、前記走査線に 電気的接続するゲート電極、および画楽電極に電気的接 続するドレイン領域を備える薄膜トランジスタとを有す る反射型液晶表示装置において、

前記画素電極は、透明導電膜と、該透明導電膜の表面に る反射型液晶表示装置。

【請求項3】 請求項1に規定する反射型液晶表示装置 の製造方法において、前記透明導電膜を形成した後、該 透明導電膜表面に無電解めっきを行って前記無電解めっ き層を形成することを特徴とする反射型液晶表示装置の 製冶方法

【請求項4】 請求項2に規定する反射型液晶表示装置 の製造方法において、前記透明導電膜を形成した後、前 記走査線を介して前記薄膜トランジスタをオン状態とし この状態で前記データ線から給電することにより前記透 30 明導電膜の表面に電解めっきを行って前記電解めっき層 を形成することを特徴とする反射型液晶表示装置の製造 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、画素スイッチング 用のアクティブ素子として薄膜トランジスタ (以下、T FTという。)を用いたアクティブマトリクス方式の反 射型液晶表示装置およびその製造方法に関するものであ る。さらに詳しくは、アクティブマトリクス基板の製造 40 工程を透過型液晶表示装置と反射型液晶表示装置との間 で共通化するための技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】アクティブマトリクス方式の液晶表示装 置では、図1に示すように、アクティブマトリクス基板 3上に区画形成された各画素領域2のそれぞれにTFT が形成されている。このTFTは、図9に示すように、 データ線に電気的接続するソース領域14、走査線に電 気的接続するゲート電極15、および画素電極40Aに

うに構成したアクティブマトリクス基板3には、図2 (A)、(B)、(C)に示すように、共通電極が形成 された対向基板70が重ねられ、これらの基板の間に液 晶層LCが封入される。反射型液晶表示装置では、図2 (B) に示すように、対向基板70の方から入射した光 が液晶層LCで光変調された後、画素電極40Aの表面 で反射され、対向基板70を再び透過して画像を表示す る。従って、画素電極40Aとしては鏡面を構成するよ うな金属層から構成される。これに対して、透過型液晶 表示装置では、図2(C)に示すように、アクティブマ トリクス基板3の方から入射した光は画素電極40Aを 透過して液晶層LCで光変調された後、対向基板70を 透過して画像を表示する。従って、画素電極40Aとし てはITO膜などといった透明導電膜から構成される。 [0003]

2

【発明が解決しようとする課題】このように、反射型液 晶表示装置と透過型液晶表示装置とは基本的な構造が共 通しているものの、画素電極40Aを構成する材料に求 められる性質が全く異なるため、従来の液晶表示装置で 形成された電解めっき層とを備えていることを特徴とす 20 はアクティブマトリクス基板3の製造工程を透過型液晶 表示装置と反射型液晶表示装置との間で大幅な共通化を 進めることができないという問題点がある。

> 【0004】そこで、本発明の課題は、透過型液晶表示 装置との間でアクティブマトリクス基板の製造工程の共 通化を大幅に進めることのできる反射型液晶表示装置お よびその製造方法を提供することにある。

> 【0005】また、本発明の課題は、透過型液晶表示装 置との間でアクティブマトリクス基板の製造工程の共通 化を進めるとともに画素電極がデータ線に対してオープ ン状態にある画素欠陥を検出することのできる反射型液 晶表示装置およびその製造方法を提供することにある。 [0006]

> 【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明では、一対の基板間に封入された液晶と、前 記一対の基板のうちの一方の基板上にマトリクス状に形 成されたデータ線および走査線と、前記一方の基板上で 前記データ線に電気的接続するソース領域、前記走査線 に電気的接続するゲート電極、および画素電極に電気的 接続するドレイン領域を備える薄膜トランジスタとを有 する反射型液晶表示装置において、前記画素電極は、透 明導電膜と、該透明導電膜の表面に形成された無電解め っき層とを備えていることを特徴とする。

【0007】本発明では画素電極を構成するにあたって 透明導電膜の表面に無電解めっき層を形成するか否かだ けで、アクティブマトリクス基板を反射型液晶表示装置 用と透過型液晶表示装置用とに使い分けできる。すなわ ち、透明導電膜を形成するまでは共通の工程で行い、そ の後、無電解めっき層を形成しなければそのまま透過型 液晶表示装置用として使用できる。これに対して、透明 電気的接続するドレイン領域16を備えている。このよ 50 導電膜を形成した場合でもその表面に無電解めっき層さ

え形成すれば反射型液晶表示装置用として使用できる。 よって、透過型液晶表示装置と反射型液晶表示装置との 間でアクティブマトリクス基板の製造工程の大部分を共 通化することができるので、多品種小ロットの液晶表示 装置の生産効率が向上する。

【0008】このような構成の反射型液晶表示装置を製 造するにあたっては、前記透明導電膜を形成した後、該 透明導電膜の表面に無電解めっきを行って前記無電解め っき層を形成する。

【0009】本発明では、前記透明導電膜の表面には無 10 電解めっき層に代えて、電解めっき層を形成することが 好ましい.

【0010】このような構成の反射型液晶表示装置を製 造するにあたっては、前記透明導電膜を形成した後、前 記走査線を介して前記TFTをオン状態としこの状態で 前記データ線から給電することにより前記透明導電膜の 表面に電解めっきを行って前記電解めっき層を形成する ことを特徴とする。

【0011】本発明でも画素電極を形成するにあたって 透明導電膜の表面に電解めっき層を形成するか否かだけ で、TFTアレイ基板を反射型液晶表示装置用と透過型 液晶表示装置用とに使い分けできるので、透明導電膜を 形成するまでは共通の工程で行うことができる。ここ で、電解めっきを行うには各透明導電膜に給電する必要 があるが、本発明では、走査線を介してTFTをオン状 態としこの状態でデータ線からTFTを介して透明導電 膜に給電するので、電解めっきを行うことができる。ま た、データ線からの給電により透明導電膜の表面にめっ きを行うので、データ線に対してオープン状態にある透 明薄電膜にはめっき層が形成されない。それ故、透明薄 電膜からなる画素電極を形成しただけでは透明であるた め検出できないような画素電極のオープンも、電解めっ き層の有無を画像解析などの方法により検出すれば、画 素電極がTFTを介してデータ線に接続しているか否か を検査できる。

[0012]

【発明の実施の形態】図面を参照して、本発明の実施の 形態を説明する。なお、以下に説明する各形態におい て、従来の液晶表示装置用アクティブマトリクス基板と 共通する機能を有する部分には同一符号を付してある。 【0013】(液晶表示装置の全体構成)図1は、液晶 表示装置のアクティブマトリクス基板の構成を模式的に 示す説明図である。

【0014】この図において、液晶表示装置1では、ア クティブマトリクス基板3上に、データ線310および 走査線150で区画形成された画素領域2を有し、いず れの画素領域2にも画素用のTFTと、このTFTを介 して画像信号が印加される液晶セルLCCとが構成され ている。データ線310に対しては、シフトレジスタ、

るデータドライバ部6が構成され、走査線150に対し ては、シフトレジスタおよびレベルシフタを備える走査 ドライバ部7が構成されている。画素領域2には、前段 の走査線との間、または容量線との間に保持容量が形成 されることもある。アクティブマトリクス基板3として は、アクティブマトリクス部だけが基板上に構成された もの、アクティブマトリクス部と同じ基板上にデータド ライバ部6が構成されたもの、アクティブマトリクス部 と同じ基板上に走査ドライバ部7が構成されたもの、ア クティブマトリクス部と同じ基板上にデータドライバ部 6および走査ドライバ部7の双方が構成されたものがあ る。ドライバ内蔵型のアクティブマトリクス基板3であ っても、データドライバ部6に含まれるシフトレジス タ、レベルシフタ、ビデオライン、アナログスイッチ等 の全てがアクティブマトリクス基板3上に構成された完 全ドライバ内蔵タイプと、それらの一部がアクティブマ トリクス基板3上に構成された部分ドライバ内蔵タイプ とがあるが、本発明はいずれのタイプにも適用できる。 【0015】以下の説明では、アクティブマトリクス部 20 の周囲にデータドライバ部6および走査ドライバ部7の 双方が構成され、かつ、アクティブマトリクス基板3が 液晶表示装置1に組み込まれたときにデータドライバ部 6および走査ドライバ部7にクロック信号や映像信号な どを入力するための端子群4がデータドライバ部6より

も緑側に配列されているものを例に説明する。 【0016】アクティブマトリクス基板3を用いて液晶 表示装置1を構成する際には、図2(A)、(B)、 (C) に示すように、アクティブマトリクス基板3に対 して、共通電極およびカラーフィルタ(いずれも図示せ 30 ず。)が形成された対向基板70が重ねられる。この状 態で、アクティブマトリクス基板3と対向基板70との 間に充填された液晶層LCは、シール剤71および封止 剤72によって封止されている。なお、対向基板70の 外周側にはブラックストライア73が構成されている。 【0017】 [実施の形態1] 図3は、液晶表示装置用 のアクティブマトリクス基板に区画形成されている画素 領域の一部を拡大して示す平面図、図4は、そのX-X、線に相当する位置での縦断面図である。

【0018】図3および図4において、液晶表示装置1 40 のアクティブマトリクス基板3では、絶縁基板10上が データ線310と走査線150とによって複数の画素領 域2に区画形成され、各画素領域2の各々に対してはT FTが形成されている。このTFTは、ソース領域14 とドレイン領域16との間にチャネルを形成するための チャネル領域17、該チャネル領域17にゲート絶縁膜 13を介して対峙するゲート電極15、該ゲート電極1 5の表面側に形成された層間絶縁膜20、該層間絶縁膜 20のコンタクトホール201を介してソース領域14 に電気的接続するソース電極31、および層間絶縁膜2 レベルシフタ、ビデオライン、アナログスイッチを備え 50 0のコンタクトホール202を介してドレイン領域16

1)

に電気的接続するITO膜からなる透明導電膜41を備 える画素電極40を有している。ソース電極31はデー タ線301の一部であり、ゲート電極15は走査線15 0の一部である。

【0019】従って、透明導電膜41だけから構成され た画素電極40を備えるアクティブマトリクス基板3を 用いて液晶表示装置1を構成すれば、図2 (C) に示す ように、アクティブマトリクス基板3の方から入射した 光は透明導電膜41 (画素電極40)を透過して液晶層 LCで光変調された後、対向基板70を透過して画像を 10 表示するので、透過型液晶表示装置を構成できる。

【0020】これに対して、本形態では、画素電極40 は、透明導電膜41と、この表面に無電解めっきにより 形成され、鏡面を備えたニッケルめっき層45Aとから 構成されている。従って、この構造のアクティブマトリ クス基板3を用いて液晶表示装置1を構成すれば、図2 (B) に示すように、対向基板70の方から入射した光 は、液晶層LCで光変調された後、透明導電膜41の表 面に形成されたニッケルめっき層45Aの表面で反射さ れ、対向基板70を再び透過して画像を表示するので、 反射型液晶表示装置を構成できる。すなわち、反射型液 晶表示装置用のアクティブマトリクス基板3であるにも かかわらず透明薄電膜41を形成するが、その代わりに その表面にニッケルめっき層45Aを形成したものを画 素電極40として用いるので、反射型液晶表示装置用の アクティブマトリクス基板3として用いることができ

【0021】図5、図6は、本形態のアクティブマトリ クス基板の製造方法を示す工程断面図である。

【0022】このようなアクティブマトリクス基板3の 30 製造方法では、まず、図5(A)に示すように、絶縁基 板10として汎用の無アリカリガラスを用いる。まず、 絶縁基板10を清浄化した後、絶縁基板10の上にCV D法(Chemical Vapor Deposit ion)やPVD法(Physical VaporD eposition) によりシリコン酸化膜などからな る下地保護膜11を形成する。CVD法としては、たと えば減圧CVD法 (LPCVD法)やプラズマCVD法 (PECVD法) などがある。PVD法としては、たと えばスパッタ法などがある。

【0023】次に、TFTの能動層となるべき真性のシ リコン膜などの半導体膜120を形成する。この半導体 膜120もCVD法やPVD法により形成できる。この ようにして得られる半導体膜120は、そのままasdeposited膜としてTFTのチャネル領域など の半導体層として用いることができる。また、半導体膜 120は、図5 (B) に示すように、レーザ光などの光 学エネルギーまたは電磁エネルギーを短時間照射して結 晶化を進めてもよい。

クを形成した後、このレジストマスクを用いて半導体膜 120をパターニングし、図5 (C) に示すように、島 状の半導体膜12とする。半導体膜12にパターニング した後は、PVD法やCVD法などでゲート絶縁膜13 を形成する。

6

【0025】次に、ゲート電極となるアルミニウム膜な どの薄膜をスパッタ形成する。通常はゲート電極とゲー ト配線とは、同一の金属材料などで同一の工程により形 成される。ゲート電極となる薄膜を堆積した後、図5 (D) に示すように、パターニングを行い、ゲート電極 15を形成する。このとき、走査線150も形成され

【0026】次に、半導体膜12に対して不純物イオン を導入し、ソース領域14およびドレイン領域16を形 成する。不純物イオンが導入されなかった部分はチャネ ル領域17となる。この方法では、ゲート電極15がイ オン注入のマスクとなるため、チャネル領域17は、ゲ ート電極15下のみに形成される自己整合構造となる が、オフセットゲート構造やLDD構造のTFTを構成 してもよい。不純物イオンの導入は、質量非分離型イオ ン注入装置を用いて注入不純物元素の水素化合物と水素 とを注入するイオン・ドーピング法、あるいは質量分離 型イオン注入装置を用いて所望の不純物イオンのみを注 入するイオン打ち込み法などを適用することができる。 イオン・ドーピング法の原料ガスとしては、水素中に希 釈された濃度が0.1%程度のホスフィン(PH₃)や ジボラン (B2 H6) などの注入不純物の水素化物を用 いる。

【0027】次に、図6 (A) に示すように、シリコン 酸化膜からなる層間絶縁膜20をCVD法あるいはPV D法で形成する。イオン注入と層間絶縁膜20の形成 後、350℃程度以下の適当な熱環境下にて数十分から 数時間の熱処理を施して注入イオンの活性化及び層間絶 縁膜20の焼き締めを行う。

【0028】次に、図6(B)に示すように、層間絶縁 膜20のうち、ソース領域14およびドレイン領域16 に相当する位置にコンタクトホール201、202を形 成する。次に、ソース電極を形成するためのアルミニウ ム膜などをスパッタ形成した後、それをパターニングし てソース電極31を形成する。このときデータ線310 も形成される。

【0029】次に、図6 (C) に示すように、層間絶縁 膜20の表面全体にスパッタ法などにより形成した IT O膜をパターニングして透明導電膜41を形成すると、 各画素領域2にTFTが形成される。従って、このよう に製造したアクティブマトリクス基板3を用いて液晶表 示装置1を構成すれば、図2(C)に示すように、アク ティブマトリクス基板3の方から入射した光が透明導電 膜41を透過する透過型液晶表示装置となる。

【0024】次に、所定のパターンをもつレジストマス 50 【0030】これに対して、本形態では、図6 (C) に

示す工程までを終えたアクティブマトリクス基板3を、 図7に示すように、無電解めっき浴8に浸漬し、図3お よび図4に示したように、透明薄電膜41の表面にニッ ケルめっき層45Aを形成する(無電解めっき工程)。 【0031】このように製造したアクティブマトリクス 基板3を用いて液晶表示装置1を構成すれば、図2

(B) に示すように、対向基板70の方から入射した光 がニッケルめっき層45Aで反射される反射型液晶表示 装置となる。従って、本形態によれば、図7に示した無 するか否かだけで、アクティブマトリクス基板3を反射 型液晶表示装置用と透過型液晶表示装置用とに使い分け できる。すなわち、透明導電膜41を形成するまでは共 通の工程で行い、しかる後に、図7に示した無電解めっ き工程においてニッケルめっき層45Aを形成しなけれ ばそのまま透過型液晶表示装置用のアクティブマトリク ス基板3を製造できる。これに対して、透明導電膜41 を形成した以降、図7に示した無電解めっき工程におい てニッケルめっき層45Aを形成すれば、画素電極40 が透明導電膜41とニッケルめっき層45Aとから構成 20 された透過型液晶表示装置用のアクティブマトリクス基 板3を製造できる。よって、透過型液晶表示装置と反射 型液晶表示装置との間でアクティブマトリクス基板3の 製造工程の大部分を共通化することができるので、多品 種小ロットの液晶表示装置1の生産効率が向上するとい う利点がある。

【0032】なお、アクティブマトリクス基板3を製造 する際には、それを多数枚取りできる大型のガラス基板 (マザー基板)にTFTアレイを作り込んだ後、それを 各アクティブマトリクス基板3に分割するのが一般的で 30 ある。このような場合でも、本形態では無電解めっき工 程でニッケルめっき層45Aを形成するので、給電する 必要がない。それ故、マザー基板の状態で、あるいはそ れを分割した後のいずれにおいてもニッケルめっき層4 5Aを形成できるという利点がある。

【0033】 [実施の形態2] 上記形態ではニッケルめ っき層を無電解めっきにより形成したが、本形態では、 ニッケルめっき層を電解めっきにより形成する点のみが 相違する。従って、本形態の以下の説明では、上記形態 と共通する機能を有する部分には同一の符号を付してそ 40 れらの詳細な説明を省略する。

【0034】本形態でも、図1を参照して説明したよう に、アクティブマトリクス基板3上に区画形成された各 画素領域2のそれぞれにTFT (画素用スイッチング素 子) が形成されている。このTFTは、図3、4を参照 して説明したように、データ線310に電気的接続する ソース領域14、走査線150に電気的接続するゲート 電極15、およびITO膜からなる透明導電膜41を備 える画素電極40に電気的接続するドレイン領域16を た画素電極40を備えるアクティブマトリクス基板3を 用いて液晶表示装置1を構成すれば、図2(C)に示す ように、アクティブマトリクス基板3の方から入射した 光は、透明導電膜41を透過して液晶層しCで光変調さ れた後、対向基板70を透過して画像を表示するので、 透過型液晶表示装置を構成できる。

【0035】これに対して、本形態では、画素電板40 は、透明導電膜41と、この透明導電膜41の表面に電 解めっきにより形成され、鏡面を備えたニッケルめっき 電解めっき工程においてニッケルめっき層45Aを形成 10 層45Bとから構成されている。従って、この構造のア クティブマトリクス基板3を用いて液晶表示装置1を構 成すれば、図2(B)に示すように、対向基板70の方 から入射した光は、液晶層しCで光変調された後、透明 導電膜41の表面に形成されたニッケルめっき層45B の表面で反射され、対向基板70を再び透過して画像を 表示するので、反射型液晶表示装置を構成できる。すな わち、反射型液晶表示装置用のアクティブマトリクス基 板3であるにもかかわらず透明導電膜41を形成してい るがその代わりにその表面にニッケルめっき層45Bを 形成したものを画素電極40としているので、反射型液 晶表示装置用のアクティブマトリクス基板3として用い ることができる。

> 【0036】このように構成したアクティブマトリクス 基板3の製造方法も、図5、図6を参照して説明した工 程までは実施の形態1と共通である。従って、図6

> (C)を示す工程までを行っただけのアクティブマトリ クス基板3を用いて液晶表示装置1を構成すれば、図2 (C) に示すように、アクティブマトリクス基板3の方 から入射した光が透明導電膜41を透過する透過型液晶 表示装置となる。

> 【0037】 これに対して、本形態では、図6(C)を 示す工程までを行ったアクティブマトリクス基板3を、 図8に示すように、電解めっき浴9に浸漬し、それに構 成されている端子群4および走査ドライバ部7から走査 線150を介してTFTのゲート電極15にオンレベル のゲート電圧を印加してTFTをオン状態とするととも に、端子群4およびデータドライバ部6からデータ線3 10およびTFTを介して透明導電膜41をマイナス電 位を印加する。この際には、アクティブマトリクス基板 3の各端子群4に接続する電極群が構成されたコネクタ 91、このコネクタ91を介して走査ドライバ部7およ びデータドライバ部6に制御信号およびマイナス電位を それぞれ供給する電源92を用いる。その結果、アクテ ィブマトリクス基板3は電解めっきが行われ、図3およ び図4に示すように、透明導電膜41の表面にはニッケ ルめっき層45Bが形成される。

> 【0038】このように製造したアクティブマトリクス 基板3を用いて液晶表示装置1を構成すれば、図2

(B) に示すように、対向基板70の方から入射した光 有している。従って、透明導電膜41だけから構成され 50 がニッケルめっき層45Aで反射される反射型液晶表示

装置となる。 従って、 本形態によれば、 図8に示した電 解めっき工程においてニッケルめっき層45Bを形成す るか否かだけで、アクティブマトリクス基板3を反射型 液晶表示装置用と透過型液晶表示装置用とに使い分けで きる。すなわち、透明導電膜41を形成するまでは共通 の工程で行い、しかる後に、図8に示した電解めっき工 程においてニッケルめっき層45Bを形成しなければそ のまま透過型液晶表示装置用のアクティブマトリクス基 板3を製造でき、透明導電膜41を形成した以降、図8 に示した電解めっき工程においてニッケルめっき層45 10 Bを形成すれば、透過型液晶表示装置用のアクティブマ トリクス基板3を製造できる。よって、透過型液晶表示 装置と反射型液晶表示装置との間でアクティブマトリク ス基板3の製造工程の大部分を共通化することができ、 多品種小ロットの液晶表示装置1の生産効率が向上す **る**.

【0039】また、本形態では、データ線310からの 給電により透明導電膜41の表面にめっきを行うので、 データ線310に対してオーアン状態にある透明導電膜 41にはニッケルめっき層45Bが形成されない。それ 20 故、透明導電膜41を形成しただけでは透明であるため 検出できないような画素電極40のオープンも、ニッケ ルめっき層45Bの有無を画像解析などの検査方法によ り検出すれば、オープン状態にある画素電極40(画 案)を検出できる。

【0040】なお、アクティブマトリクス基板3を製造 する際には、それを多数枚取りできる大型のガラス基板 (マザー基板) にTFTアレイを作り込んだ後、それを 各アクティブマトリクス基板3に分割するのが一般的で ある。このような場合でも、マザー基板において各アク 30 ティブマトリクス基板3に切断されるべき各領域には、 データドライバ部6、走査ドライバ部7、およびデータ ドライバ部6や走査ドライバ部7にクロック信号や映像 信号などを入力するための端子群4が作り込まれてい る。それ故、マザー基板からアクティブマトリクス基板 3を複数枚取りするような製造方法であっても、マザー 基板からアクティブマトリクス基板3を分割した後であ れば、端子群4を利用して各TFTの透明導電膜41へ の給電を行うことができるので、各透明導電膜41の表 面への電解めっきが可能である。

【0041】[その他の実施の形態]なお、上記のいず れの形態でも透明導電膜41の表面にニッケルめっき層 を形成した場合を例に説明したが、その他の金属層でも よいことは勿論である。

[0042]

【発明の効果】以上説明したように、本発明では反射型 液晶表示装置であるにもかかわらず、画素電極を形成す るにあたって透明導電膜を形成する代わりに、この透明 導電膜の表面にめっき層を形成したことに特徴を有す る。従って、本発明によれば、透明導電膜を形成した以 50 7 走査ドライバ部

降、その表面にめっき層を形成しなければそのまま透過 型液晶表示装置用として使用でき、その表面にめっき層 さえ形成すれば反射型液晶表示装置用として使用でき る。それ故、透過型液晶表示装置と反射型液晶表示装置 との間でアクティブマトリクス基板の製造工程の大部分 を共通化することができるので、多品種小ロットの場合 に生産効率が向上する。

10

【0043】走査線を介してTFTをオン状態としこの 状態でデータ線からTFTを介して透明薄電膜に給電し て電解めっきを行う場合には、データ線に対してオープ ン状態にある透明導電膜にはめっき層が形成されない。 それ故、透明導電膜を形成しただけでは透明であるため 検出できないような画素電極のオープンも、電解めっき 層の有無を画像解析などの方法により検出すれば確実に 検出できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】液晶表示装置のアクティブマトリクス基板の構 成を模式的に示す平面図である。

【図2】(A)は液晶表示装置の構成を模式的に示す平 面図、(B)は反射型液晶表示装置の原理を模式的に示 す平面図、(C)は透過型液晶表示装置の原理を模式的 に示す平面図である。

【図3】本発明の実施の形態1、2に係る液晶表示装置 用アクティブマトリクス基板に区画形成されている画素 領域の一部を拡大して示す平面図である。

【図4】本発明の実施の形態1、2に係る液晶表示装置 用アクティブマトリクス基板を図3のX-X、線に相当 する位置で切断したときの縦断面図である。

【図5】図3および図4に示すアクティブマトリクス基 板の製造方法を示す工程断面図である。

【図6】図3および図4に示すアクティブマトリクス基 板の製造方法において、図5に示す工程以降に行う各工 程の工程断面図である。

【図7】本発明の実施の形態1に係る液晶表示装置用ア クティブマトリクス基板の製造方法において図6に示す 工程の後に行う無電解めっき工程を模式的に示す説明図 である。

【図8】本発明の実施の形態2に係る液晶表示装置用ア クティブマトリクス基板の製造方法において図6に示す 40 工程の後に行う電解めっき工程を模式的に示す説明図で ある。

【図9】従来の液晶表示装置用アクティブマトリクス基 板の縦断面図である。

【符号の説明】

- 1 液晶表示装置
- 2 画素領域
- 3 アクティブマトリクス基板
- 4 端子群
- 6 データドライバ部

11

10	祀禄基权
13	ゲート絶縁膜
14	ソース領域
15	ゲート電気

ドレイン領域 16

17 チャネル領域

31 ソース電極

40 画素電極

透明導電膜 41

45A、45B ニッケルめっき層

12

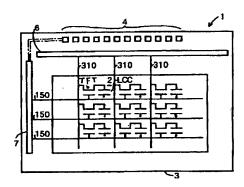
70 対向基板

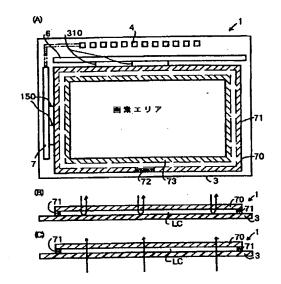
150 走査線

310 データ線

【図1】

【図2】





【図4】

15, 150 20 202 41 45A, 45B

